

研究タイトル：

各種組み込みシステムの開発



氏名： 中井 一文 / Kazufumi Nakai E-mail: nakai-k@toba-cmt.ac.jp

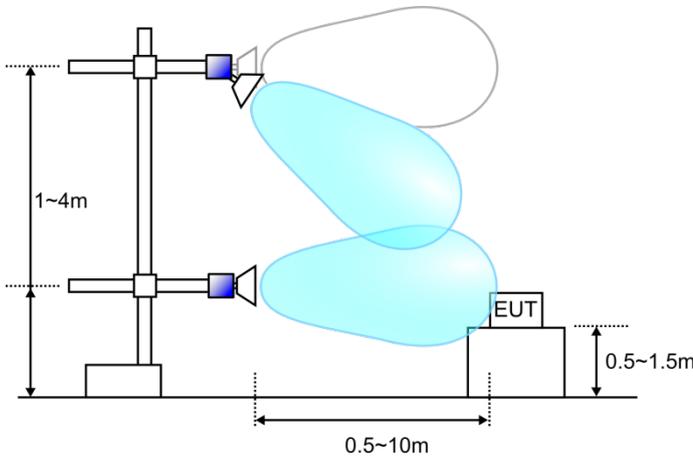
職名： 准教授 学位： 博士(工学)

所属学会・協会： 電子情報通信学会、IEEE

キーワード： 組み込みシステム、制御・システム工学

技術相談
提供可能技術： GPIB (SCPI)による自動計測器制御

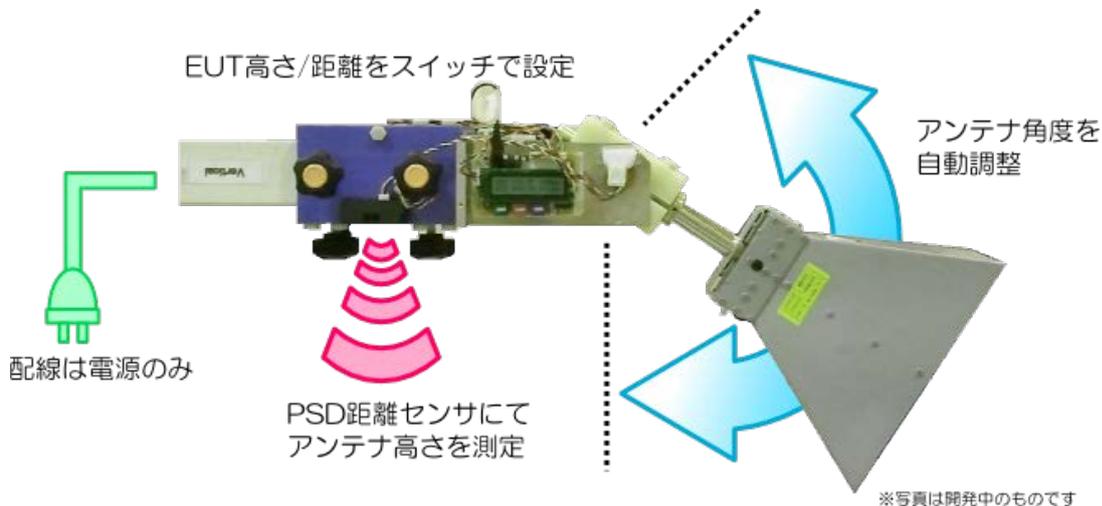
研究内容：



開発している組み込みシステムの一例

左図は EMC 試験における試験配置図です。この試験では EUT (試験対象)の放射エミッションを測定するため、アンテナのメインローブを常に EUT に向け続けるという測定法があります。

市販の測定設備ではこの測定法に対応させる拡張は高価・設置の制約が大きいため、下図のように電源をとるだけで既存の測定設備に取り付けられるシステムを開発しました。



提供可能な設備・機器：

名称・型番(メーカー)

名称・型番(メーカー)	